

**Влияние адсорбционных процессов на электрофизические свойства поверхностных слоев диэлектрических материалов**

**Veimer, Vladimir; Roninson, Aleksander** Электрофизические свойства полупроводниковых и диэлектрических материалов 1983 / с. 57-67 : ил [https://www.estr.ee/record=b1291687\\*est](https://www.estr.ee/record=b1291687*est) <https://digikogu.taltech.ee/et/item/9447de85-407e-426e-843d-2f0c98097f4e>

**Влияние влажности на поверхностную и объемную проводимость некоторых диэлектриков**

**Bender, Villem; Roninson, Aleksander; Silas, Aarne** Электрофизические свойства полупроводниковых и диэлектрических материалов 1983 / с. 79-88 : ил [https://www.estr.ee/record=b1291687\\*est](https://www.estr.ee/record=b1291687*est) <https://digikogu.taltech.ee/et/item/9447de85-407e-426e-843d-2f0c98097f4e>

**Влияние механических напряжений на поверхностную и объемную проводимости некоторых диэлектриков**

**Bender, Villem; Veimer, Vladimir; Mere, Arvo; Roninson, Aleksander; Silas, Aarne** Электрофизические свойства полупроводниковых и диэлектрических материалов 1986 / с. 65-72 : ил [https://www.estr.ee/record=b1296001\\*est](https://www.estr.ee/record=b1296001*est) <https://digikogu.taltech.ee/et/item/65e24755-71eb-4a99-b9fe-e1308121ed89>

**Влияние отжига на свойства порошков Cds : Cu : Cl**

**Tuvike, Tiit; Palmre, Oie; Vallaste, Heikki; Päid, Imbi; Kuusmets, Eela; Petrov, P.I.** Электрофизические свойства полупроводниковых и диэлектрических материалов 1988 / с. 37-45

**Влияние статических и динамических деформаций на электроизоляционные свойства резин**

**Bender, Villem; Veimer, Vladimir; Mere, Arvo** Электрофизические свойства полупроводниковых и диэлектрических материалов 1988 / с. 100-108

**Гетероструктура CdS/TiO<sub>2</sub> как фотоанод электрохимической ячейки**

**Erm, Ants** Электрофизические свойства полупроводниковых и диэлектрических материалов 1988 / с. 66-83

**Изменение интенсивности рентгенолюминесценции в процессе окрашивания содалитов**

**Ruus, Tõnu** Электрофизические свойства полупроводниковых и диэлектрических материалов 1986 / с. 31-37 : ил [https://www.estr.ee/record=b1296001\\*est](https://www.estr.ee/record=b1296001*est) <https://digikogu.taltech.ee/et/item/65e24755-71eb-4a99-b9fe-e1308121ed89>

**Изменение параметров интегральных схем при анализе в растровом электронном микроскопе**

**Meiler, Boriss** Электрофизические свойства полупроводниковых и диэлектрических материалов 1986 / с. 85-92 : ил [https://www.estr.ee/record=b1296001\\*est](https://www.estr.ee/record=b1296001*est) <https://digikogu.taltech.ee/et/item/65e24755-71eb-4a99-b9fe-e1308121ed89>

**Измерение СВЧ фотопроводимости в материалах с высокой проводимостью**

**Vallaste, Heikki; Mellikov, Enn; Tuvike, Tiit; Palmre, Oie** Электрофизические свойства полупроводниковых и диэлектрических материалов 1986 / с. 57-63 : ил [https://www.estr.ee/record=b1296001\\*est](https://www.estr.ee/record=b1296001*est) <https://digikogu.taltech.ee/et/item/65e24755-71eb-4a99-b9fe-e1308121ed89>

**Импульсно-плазменное легирование кремния сурьмой**

**Gavrilov, Aleksei; Katšurin, G.A.** Электрофизические свойства полупроводниковых и диэлектрических материалов 1983 / с. 15-28 : ил [https://www.estr.ee/record=b1291687\\*est](https://www.estr.ee/record=b1291687*est) <https://digikogu.taltech.ee/et/item/9447de85-407e-426e-843d-2f0c98097f4e>

**Импульсно-плазменный отжиг слоев кремния, имплантированных бором**

**Gavrilov, Aleksei; Katšurin, G.A.** Электрофизические свойства полупроводниковых и диэлектрических материалов 1983 / с. 3-13 : ил [https://www.estr.ee/record=b1291687\\*est](https://www.estr.ee/record=b1291687*est) <https://digikogu.taltech.ee/et/item/9447de85-407e-426e-843d-2f0c98097f4e>

**Индикатор качества противокоррозионной защиты**

**Veimer, Vladimir; Kurik, Lembit; Sinivee, Veljo** Электрофизические свойства полупроводниковых и диэлектрических материалов 1988 / с. 109-115

**Ионные процессы в каркасных алюмосиликатах**

**Denks, Viktor; Mere, Arvo; Ruus, Tõnu** Электрофизические свойства полупроводниковых и диэлектрических материалов 1983 / с. 35-51 : ил [https://www.estr.ee/record=b1291687\\*est](https://www.estr.ee/record=b1291687*est) <https://digikogu.taltech.ee/et/item/9447de85-407e-426e-843d-2f0c98097f4e>

**Исследование миграции примеси меди в моноцистальах сульфида кадмия**

**Aarna, Heiti; Reiter, Erik** Электрофизические свойства полупроводниковых и диэлектрических материалов 1986 / с. 43-48 : ил [https://www.estr.ee/record=b1296001\\*est](https://www.estr.ee/record=b1296001*est) <https://digikogu.taltech.ee/et/item/65e24755-71eb-4a99-b9fe-e1308121ed89>

**Исследование углов смачивания некоторых диэлектрических материалов**

**Veimer, Vladimir; Bender, Villem; Kurik, Lembit; Udris, V.** Электрофизические свойства полупроводниковых и диэлектрических материалов 1983 / с. 69-78 : ил [https://www.estr.ee/record=b1291687\\*est](https://www.estr.ee/record=b1291687*est) <https://digikogu.taltech.ee/et/item/9447de85-407e-426e-843d-2f0c98097f4e>

**Источник стабилизированного тока для многократного анодного окисления полупроводников**

**Gavrilov, Aleksei; Košelap, Andrei** Электрофизические свойства полупроводниковых и диэлектрических материалов 1988 / с.

**Концентрационное уширение полос краевого излучения сульфида кадмия**

**Krustok, Jüri; Piibe, Toomas** Электрофизические свойства полупроводниковых и диэлектрических материалов 1988 / с. 22-28

**Межфазное взаимодействие и ориентационные соотношения в системе никель - арсенид галлия**

**Meiler, Boriss** Электрофизические свойства полупроводниковых и диэлектрических материалов 1988 / с. 3-12

**Металлографическое исследование арсенида галлия с помощью электрохимического травления**

**Meiler, Boriss** Электрофизические свойства полупроводниковых и диэлектрических материалов 1988 / с. 13-21

**Определение концентрационного профиля с помощью двух выпрямляющих контактов**

**Mankin, Romi; Paat, Aadu** Электрофизические свойства полупроводниковых и диэлектрических материалов 1983 / с. 29-33 : ил [https://www.estr.ee/record=b1291687\\*est](https://www.estr.ee/record=b1291687*est) <https://digikogu.taltech.ee/et/item/9447de85-407e-426e-843d-2f0c98097f4e>

**Перераспределение вещества в поле внешних сил**

**Aarna, Heiti; Mankin, Romi; Reiter, Erik** Электрофизические свойства полупроводниковых и диэлектрических материалов 1986 / с. 39-41 [https://www.estr.ee/record=b1296001\\*est](https://www.estr.ee/record=b1296001*est) <https://digikogu.taltech.ee/et/item/65e24755-71eb-4a99-b9fe-e1308121ed89>

**Применение в ТПИ растворного электронного микроскопа в материаловедении**

**Paat, Aadu** Электрофизические свойства полупроводниковых и диэлектрических материалов 1986 / с. 79-84 [https://www.estr.ee/record=b1296001\\*est](https://www.estr.ee/record=b1296001*est) <https://digikogu.taltech.ee/et/item/65e24755-71eb-4a99-b9fe-e1308121ed89>

**Природа красной полосы люминесценции в CdS : Ag : Cl**

**Krustok, Jüri; Mädasson, Jaan; Altosaar, Mare** Электрофизические свойства полупроводниковых и диэлектрических материалов 1986 / с. 23-30 : ил [https://www.estr.ee/record=b1296001\\*est](https://www.estr.ee/record=b1296001*est) <https://digikogu.taltech.ee/et/item/65e24755-71eb-4a99-b9fe-e1308121ed89>

**Процессы дефектообразования в примесном сульфиде кадмия**

**Mädasson, Jaan; Altosaar, Mare; Tomson, A.; Kukk, Peeter-Enn** Электрофизические свойства полупроводниковых и диэлектрических материалов 1988 / с. 57-65

**Рекристаллизация порошков Al<sub>11</sub>B<sub>6</sub>I**

**Mellikov, Enn** Электрофизические свойства полупроводниковых и диэлектрических материалов 1988 / с. 46-56

**Установка для измерения диэлектрических потерь порошковых материалов в широком интервале температур (80-600 К) и в условиях высокого вакуума**

**Mere, Arvo** Электрофизические свойства полупроводниковых и диэлектрических материалов 1983 / с. 53-56 : ил [https://www.estr.ee/record=b1291687\\*est](https://www.estr.ee/record=b1291687*est) <https://digikogu.taltech.ee/et/item/9447de85-407e-426e-843d-2f0c98097f4e>

**Установка для многократного анодного окисления полупроводников**

**Gavrilov, Aleksei** Электрофизические свойства полупроводниковых и диэлектрических материалов 1986 / с. 73-78 : ил [https://www.estr.ee/record=b1296001\\*est](https://www.estr.ee/record=b1296001*est) <https://digikogu.taltech.ee/et/item/65e24755-71eb-4a99-b9fe-e1308121ed89>

**Физико-химический анализ несовершенных полупроводниковых кристаллов**

**Kukk, Peeter-Enn** Электрофизические свойства полупроводниковых и диэлектрических материалов 1986 / с. 3-22 : ил [https://www.estr.ee/record=b1296001\\*est](https://www.estr.ee/record=b1296001*est) <https://digikogu.taltech.ee/et/item/65e24755-71eb-4a99-b9fe-e1308121ed89>

**Фотолюминесценция химически пульверизованных пленок**

**Erm, Ants; Krunks, Malle; Mellikov, Enn** Электрофизические свойства полупроводниковых и диэлектрических материалов 1988 / с. 85-93

**Центры рекомбинации в легированном серебром и хлором сульфиде кадмия**

**Krustok, Jüri; Mädasson, Jaan; Altosaar, Mare; Tomson, A.; Kukk, Peeter-Enn** Электрофизические свойства полупроводниковых и диэлектрических материалов 1988 / с. 29-36

**Электрофизические свойства тонкопленочных барьеров шоттки на основе сульфида кадмия, изготовленного методом химической пульверизации**

**Krunks, Malle; Mellikov, Enn; Seilenthal, Mats** Электрофизические свойства полупроводниковых и диэлектрических материалов 1986 / с. 49-55 : ил [https://www.estr.ee/record=b1296001\\*est](https://www.estr.ee/record=b1296001*est) <https://digikogu.taltech.ee/et/item/65e24755-71eb-4a99-b9fe-e1308121ed89>